Caracterización de Fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) para Aplicaciones Espaciales

Departamento de física, FCEyN, UBA

Laboratorio de Integración Nanoelectórnica (LINE), Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad de San Martín (UNSAM)

Tomás E. Ferreira Chase

Lucas Finazzi

Federico Izraelevitch (fhi@unsam.edu.ar)

NANOELECTRÓNICA

LABORATORIO DE INTEGRACIÓN

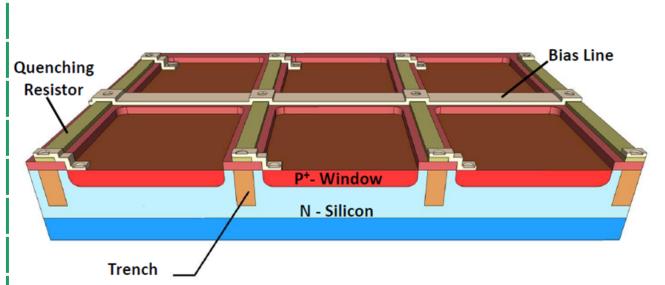


(tomaschase96@gmail.com)

(lucasfinazzi.94@gmail.com)

Marco: Proyecto LabOSat ¹

Es una plataforma electrónica para llevar a cabo experimentos en ambientes hostiles.

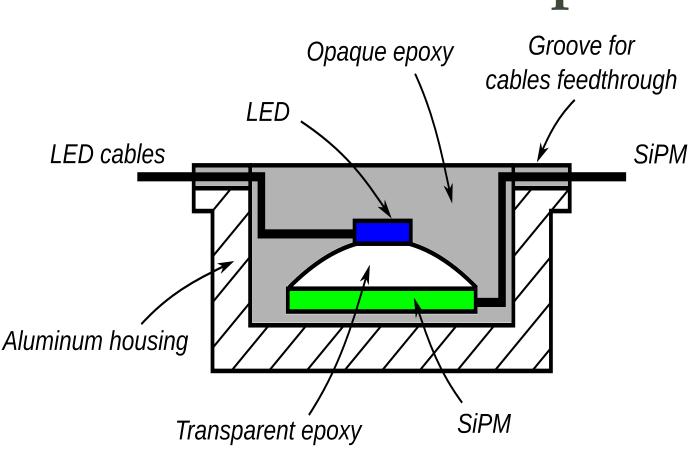


En la actualidad se están utilizando para caracterizar memorias no volátiles en órbita dentro de satélites de Satellogic ².

próxima misión incluirá novedosos fotomultiplicadores de silicio (SiPM) Sensl C-Series FC-60035-SMT 3 de **6x6 mm²**.

La caracterización permitió diseñar correctamente la electrónica asociada y para comparar con las mediciones en orbita.

Encapsulado Oscuro



Se fabricaron encapsulados SiPM cables oscuros de 10x10 mm² con el SiPM y un LED para poder estudiar el dispositivo a iluminado 0 oscuras en órbita.

Se usaron dos celdas

peltier y un sistema de

agua para modificar

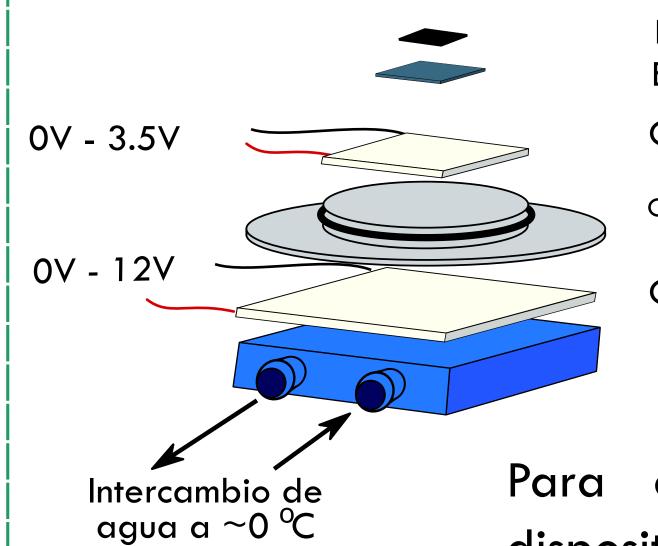
por

oscuro

refrigeración

encapsulado

Dispositivo experimental



RTD PT1000 Encapsulado Celda Peltier TEC1-4905 Conductor térmico (aluminio)

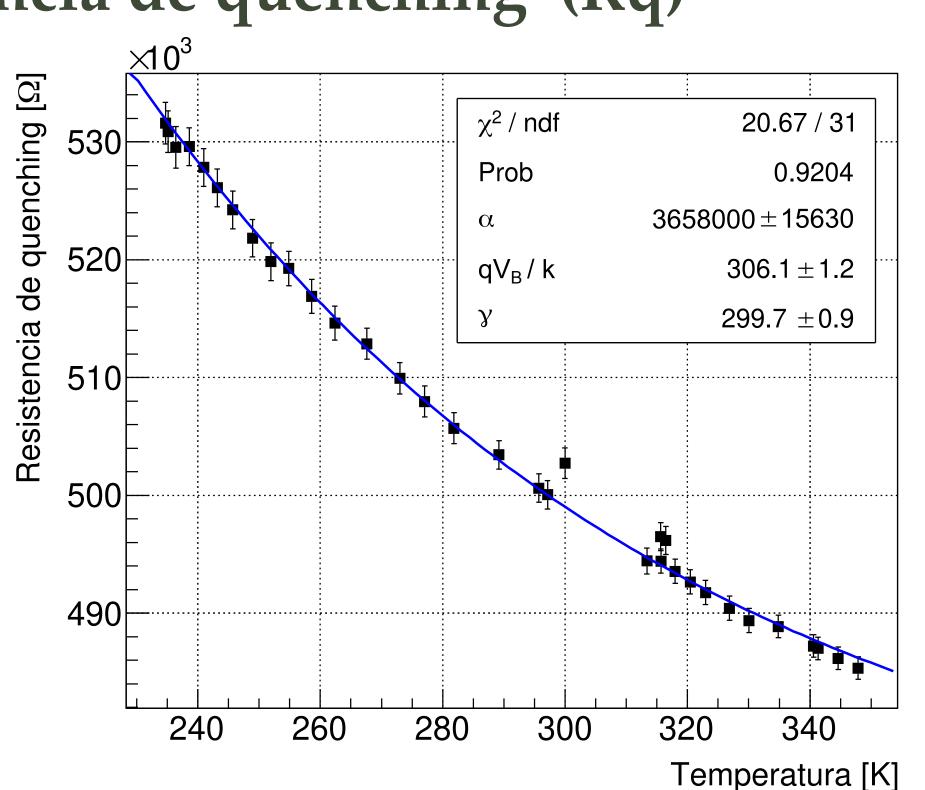
Celda Peltier TEC1-12706 Radiador

entre -40°C y 80°C. Para el control y medición de los dispositivos a estudiar se utilizaron SMU.

la temperatura del

Resistencia de quenching (Rq)

Se obtuvieron curvas 🔠 I-V distintas del temperaturas SiPM en polarización directa con el LED apagado. Para cada temperatura, la Rq se calcula a partir de la pendiente de la región lineal en una curva I-V del SiPM.



Conociendo las técnicas de fabricacion y las especificaciones deseadas, se supuso que el material de Rq es poly-Si dopado con impurezas P, y se lo ajustó por el modelo 4

$$R_q(T) = lpha rac{\exp(rac{qV_B}{kT})}{\sqrt{T} \mathrm{sinh}(rac{\gamma}{T})}$$

donde V_B es el built-in potential.

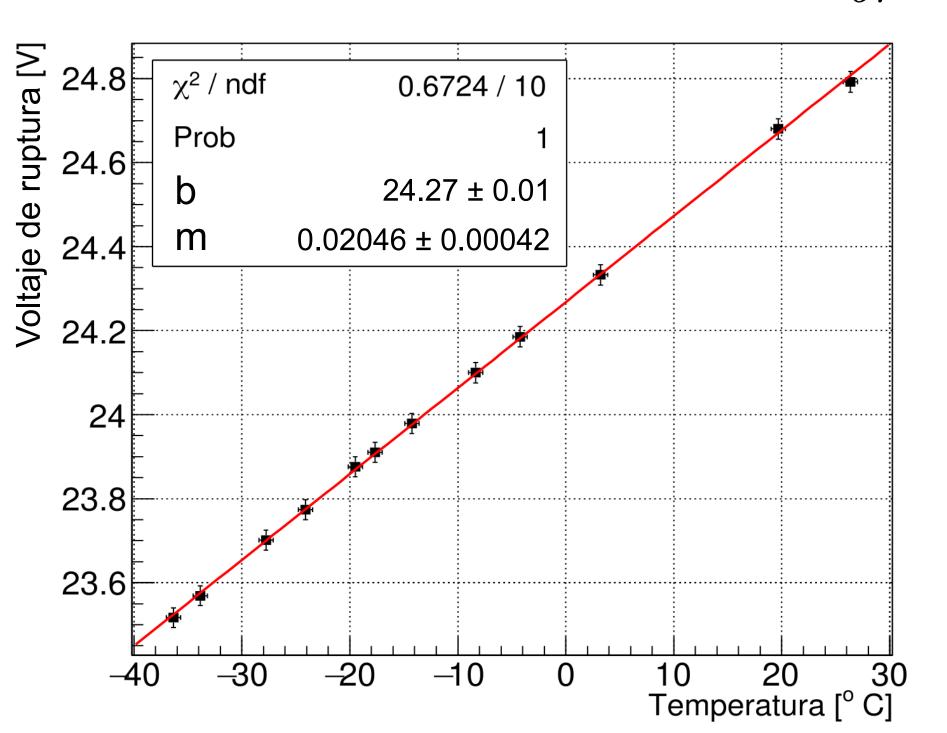
Voltaje de ruptura (Vbr)

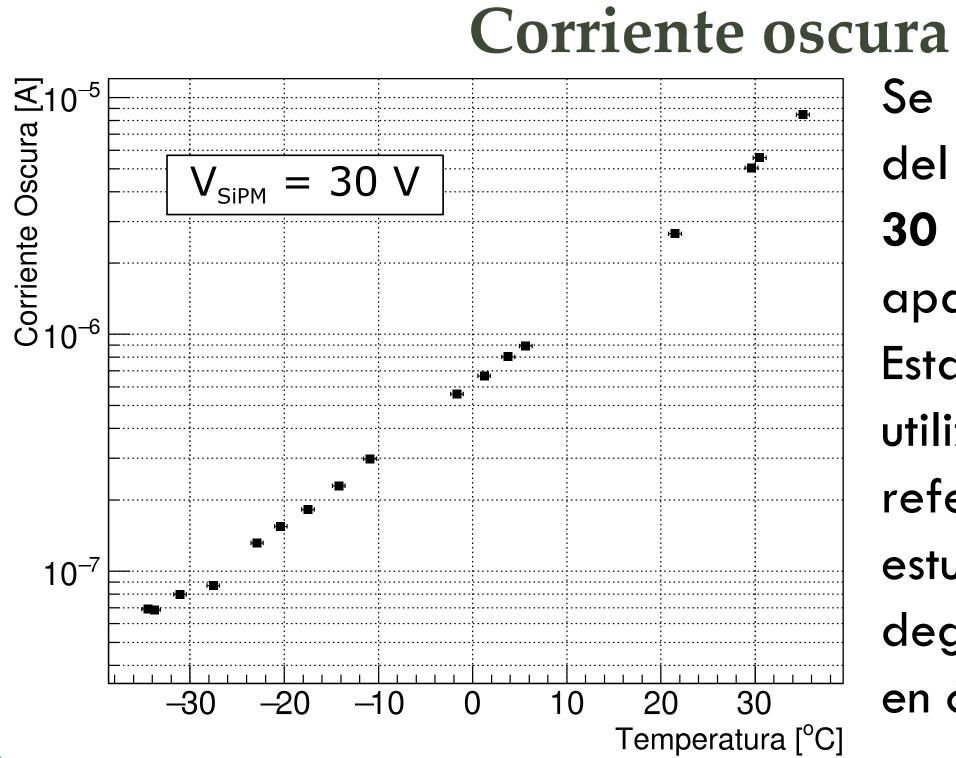
LINE

Se obtuvieron curvas I-V para distintas temperaturas con el SiPM en inversa. Para voltajes cercanos luego de la ruptura, se puede modelar la

variación de la corriente como ⁵:

obtuvo relacion temperatura, con variación una aproximada de 20.5 mV por grado.

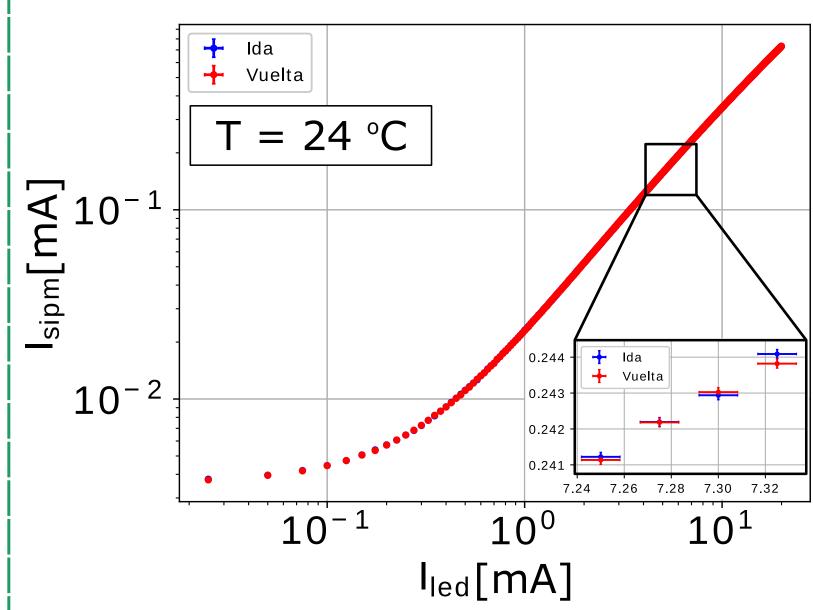




Se midió la corriente del SiPM en inversa a LED el con apagado.

Estas mediciones utilizarán como referencia para estudiar una posible degradación del SiPM en órbita.

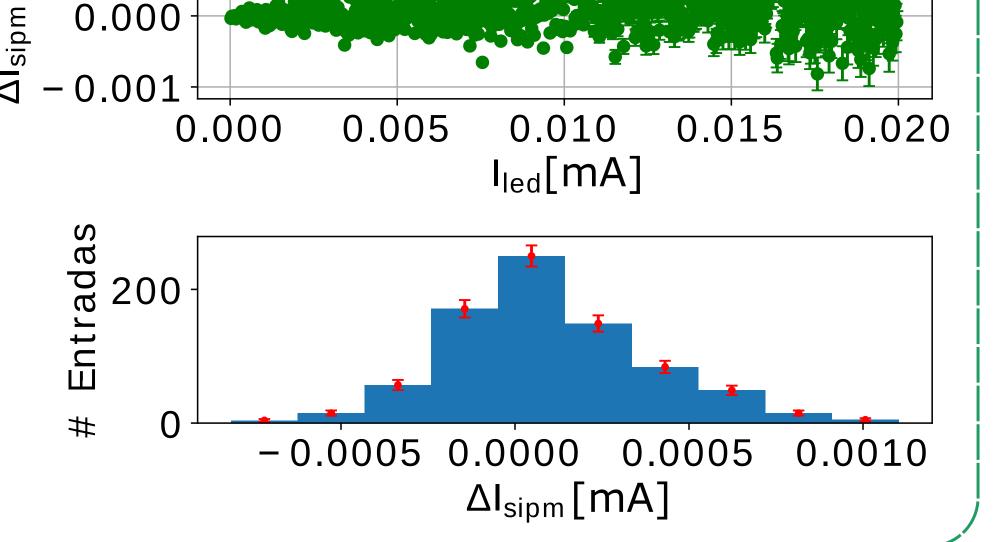
Curvas $I_{SiPM}(I_{LED})$ Se observó histéresis en



0.001

los gráficos estudiados. Mediante análisis un detallado, se observó que ésta era producto de un aumento en temperatura del encapsulado a causa disipación potencia del LED.

Se logró mitigar histéresis mediante software de control de temperatura. muestra diferencia Δ_{SiPM} entre la ida y la vuelta.



Conclusiones

Se desarrolló un protocolo de caracterización de SiPMs que permitirá estudiar cada componente en forma individual antes de ser integrado en las misiones satelitales.

Se tomaron las mediciones que serán referencia para la misión espacial próxima.

Se observó también que el encapsulado se calienta al encender el LED, produciendo una histéresis indeseada. Entender este problema permitirá determinar como se medirá en órbita.

Referencias

- [1] Proyecto Labosat: http://labosat.unsam.edu.ar
- [2] Satellogic: https://www.satellogic.com/
- [3] http://sensl.com/downloads/ds/DS-MicroCseries.pdf
- [4] Modeling and Optimization of Monolithic
- Polycrystalline Silicon Resistors, L. Gerzberg et al. [5] Characterization of Three High Efficiency and Blue Sensitive Silicon Photomultipliers, N. Otte et al.